

1. Record Nr.	UNINA9910136366303321
Autore	Ryan Jason
Titolo	2015 IEEE International Integrated Reliability Workshop Final Report : S. Lake Tahoe, California, October 11-15, 2015
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2016
ISBN	1-4673-7396-6
Descrizione fisica	1 online resource (183 pages)
Disciplina	621.3815
Soggetti	Integrated circuits - Reliability Semiconductors - Reliability
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di contenuto	PLATFORM TECHNICAL PRESENTATIONS -- POSTER PRESENTATIONS-REFEREED -- POSTER PRESENTATIONS-OPEN -- Tutorials -- Discussion Group (DG) Summaries -- BIOGRAPHIES -- PICTURES.